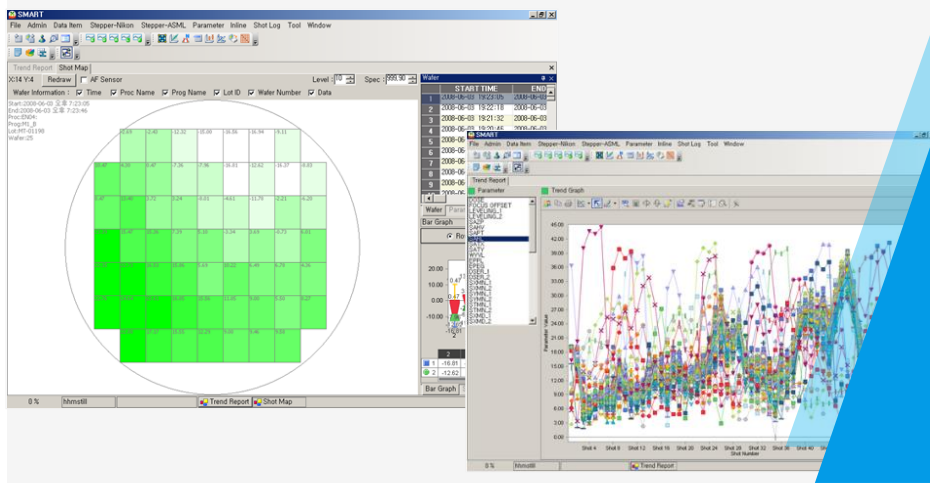


포토설비 생산성 향상

FAB, Wafer, OEE, Shot Map Analysis, Wafer Map Analysis



Project Description

- 고객 : 반도체 가공 공정
- 솔루션 : Nexplant QMS(OEE)
- 범위 : 수율분석

01 The Challenge

- 반도체 FAB의 생산성을 좌우하는 Stepper 설비의 생산 현황 분석 불가
- 대용량 Log 데이터를 Excel로 분석 시 상당 시간 소요됨
- 생산성 저하 원인 분석 불가

02 The Solution

- 설비 Log 자동 수집
- Log File 자동 해석 후 데이터 Summary 제공
- Wafer Shot Data와 Condition Data 수치 해석, Shot Data를 Wafer Map으로 분석

03 Benefits

- 고가 설비 추가 구매 없이 FAB 생산성 향상
- Log File 분석 시간 단축
- 레시피 내의 조정 필요한 파라미터 즉시 분석